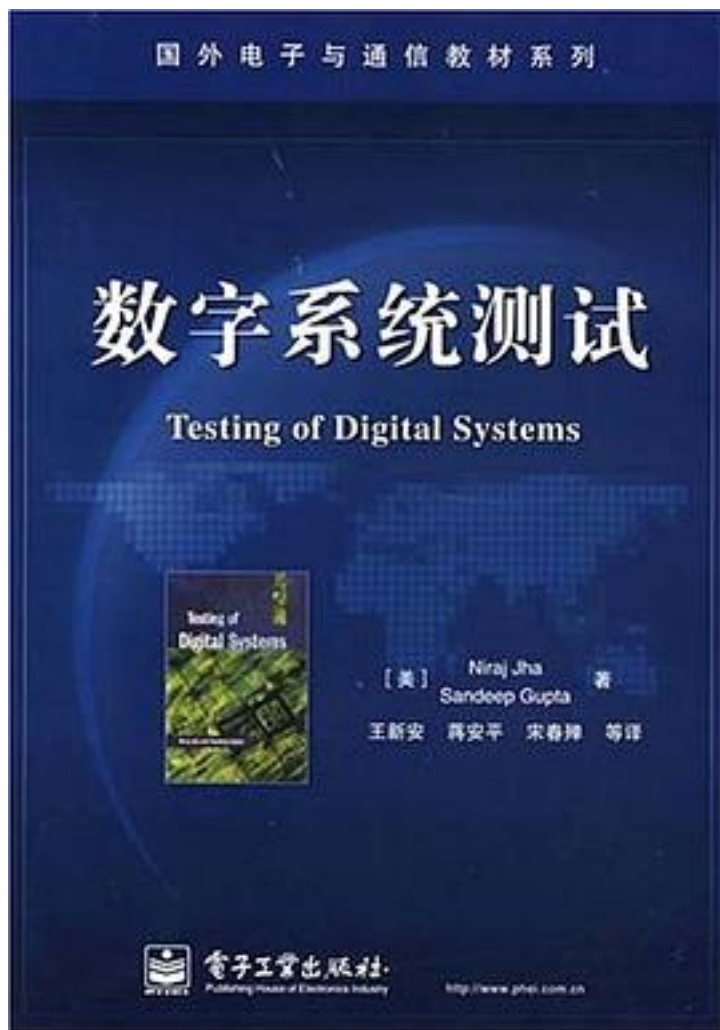


数字系统测试



[数字系统测试_下载链接1](#)

著者:[美]NirajJha, Sa

出版者:电子工业

出版时间:2007-6

装帧:

isbn:9787121045424

在半导体集成电路的设计与制造过程中，测试的重要性越来越突出，有关数字系统测试

方面的书籍也不断出现，本书是这些书籍中内容十分全面丰富的一本。本书系统地介绍了数字系统测试相关方面的知识，包括基础内容方面的自动测试向量生成、可测性设计、内建自测试等，高级内容方面包括IDDQ测试、功能测试、延迟故障测试、CMOS测试、存储器测试以及故障诊断等，并论述了最新的测试技术，包括各种故障模型的测试生成、集成电路不同层次的测试技术以及系统芯片的测试综合等，其内容涵盖了当前数字系统测试与可测试性设计方面的基础知识与研究现状等。

本书可作为高等学校计算机、微电子、电子工程等专业的高年级本科生和研究生的教材与参考书，也可供从事相关领域工作，特别是集成电路设计与测试的科研与工程技术人员参考。

作者介绍:

目录:

[数字系统测试_下载链接1](#)

标签

简体中文

数字系统测试

数字系统

中国

2007

评论

[数字系统测试_下载链接1](#)

书评

[数字系统测试_下载链接1](#)